

线性最小均方估计(linear minimum mean square error estimation)

前提: 不知道 $f(\theta)$, 知道 θ 的一、二阶矩特性

准则: 使均方误差最小的线性估计

实现:

$$\hat{\theta}_{lms} = \sum_{i=1}^{N} a_i z_i + b$$



第八章 检测理论

- 8.1 假设检验的基本概念(重点)
- 8.2 判决准则(重点)
- 8.3 检测性能及其蒙特卡罗仿真
- 8.4 复合假设检验
- 8.6 噪声中信号的检测



8.1 假设检验的基本概念

- ➤ H₁ 和 H₀ 是互不相容的,这是最简单的二元假设问题, 对两种假设进行判决称为二元假设检验问题;
- ➤ 更一般的问题是有M个假设,称为M元假设问题,对M 个假设进行判决称为M元假设检验问题。



假设检验的实质是对观测空间进行划分。

如果观测数据落在 Z_0 区域,那么判 H_0 成立;如果观测数据落在 Z_1 区域,则判 H_1 成立。所以 Z_0 也叫 H_0 的判决域, Z_1 也叫 H_1 的判决域。

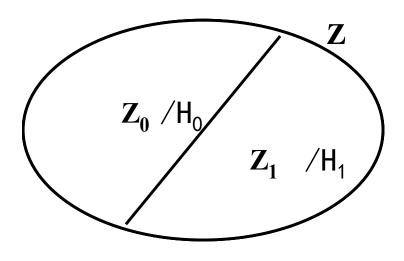


图8.1 观测空间



8.2 判决准则

1、最大后验概率准则

在观测到数据**z**的情况下,可以计算出后验概率 $P(H_1|z)$ 和 $P(H_0|z)$,对二个后验概率进行比较,判定后验概率大所对应 的那个假设成立,则判决公式为:

$$\frac{P(H_1|z)}{P(H_0|z)} \underset{<}{\overset{H_1}{>}} 1 \longrightarrow \Lambda(z) = \frac{f(z|H_1)}{f(z|H_0)} \underset{<}{\overset{H_1}{>}} \frac{P(H_0)}{P(H_1)} = \eta_0$$



对于二元假设检验,有四种可能结果

 H_0 为真,判 H_0 成立 ——正确判决

H₁为真,判H₁成立 ——正确检测

H₀为真,判H₁成立 ——虚警(第一类错误)

 H_1 为真,判 H_0 成立 ——漏警(第二类错误)

发现概率或检测概率: $P_D = P(D_1 \mid H_1) = \int_{Z_1} f(z \mid H_1) dz$

虚警概率(常用 α 表示): $P_F = P(D_1 \mid H_0) = \int_{Z_1} f(z \mid H_0) dz = \alpha$

漏警概率(常用β表示): $P_M = P(D_0 | H_1) = \int_{Z_0} f(z | H_1) dz = \beta$



2、贝叶斯准则

已知信号的先验概率和代价因子,使统计平均代价最小。

统计平均代价:

$$C = \sum_{i=0}^{1} \sum_{j=0}^{1} C_{ij} P(D_i, H_j) = \min$$

代价因子C_{ii}表示H_i为真,判决为H_i所付出的代价。

判决表达式为:

假设检验问题转化似然比检验

$$\frac{f(z \mid H_1)}{f(z \mid H_0)}$$

$$\begin{array}{c}
H_1 \\
\downarrow \\
H_0
\end{array}$$

极然此
$$\frac{f(z|H_1)}{f(z|H_0)}$$
 $\stackrel{H_1}{\underset{H_0}{\stackrel{}_{\sim}}}$ $\frac{P(H_0)(C_{10}-C_{00})}{P(H_1)(C_{01}-C_{11})}$ 订限



答疑

估计与检测是一致的

【检测】高斯噪声中恒定电平的检测

$$H_0: z(n) = v(n)$$
 $n = 0, 1, ..., N-1$
 $H_1: z(n) = A + v(n)$

【估计】 用估计理论来考察检测问题

$$z(n) = \theta + v(n) \quad n = 0, 1, ..., N - 1$$

$$\theta = 0 \quad or \quad A$$
最大似然估计
$$\hat{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} z(n)$$



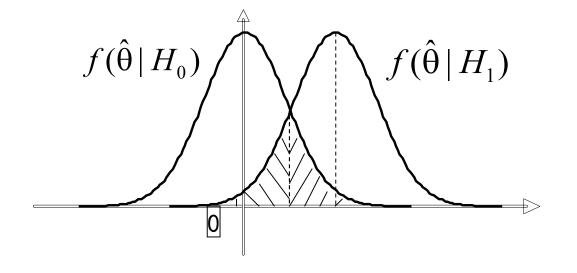
答疑

估计量的分布

$$\hat{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} z(n)$$

$$\hat{\theta} \sim N(0, \sigma^2 / N)$$
 under H_0

$$\hat{\theta} \sim N(A, \sigma^2 / N)$$
 under H_1



$$\gamma = \frac{A}{2}$$



习题:

3、最小总错误概率准则 (常应用在数字通信中)

在已知信号的先验概率 $P(H_1)$ 和 $P(H_0)$ 的条件下,使总错误概率最小:

$$P_e = P(D_1, H_0) + P(D_0, H_1) = P_F P(H_0) + P_M P(H_1) = \min$$

相当于贝叶斯准则中
$$C_{00} = C_{11} = 0$$
, $C_{01} = C_{10} = 1$

等价于最大后验概率准则

判决规则为:
$$\Lambda (z) \stackrel{H}{\underset{0}{\gtrless}} \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$$

例8.2 高斯白噪声中直流电平的检测问题。设有两种假设

 $H_0: z_i = v_i$, i = 1, 2, ..., N

 $H_1: z_i = A + v_i$, i = 1, 2, ..., N

其中 $\{v_i\}$ 是服从均值为零、方差为 σ^2 的高斯白噪声序列,假定参数A是已知的,且A>0,求贝叶斯准则(或最小总错误概率准则)的判决表达式,并确定判决性能。

【解】 两种假设下的似然函数为:

$$f(\mathbf{z}|H_0) = \prod_{i=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} exp\left(-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$f(\mathbf{z}|H_1) = \prod_{i=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} exp \left[-\frac{(z_i - A)^2}{2\sigma^2} \right]$$

$$\Lambda(\mathbf{z}) = \frac{\prod_{i=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} exp\left[-\frac{(z_i - A)^2}{2\sigma^2}\right]}{\prod_{i=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} exp\left(-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}\right)} = exp\left[\frac{NA}{\sigma^2} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z_i - \frac{1}{2} A\right)\right] < \eta_0$$

$$H_0$$

对数似然比为:
$$\ln \Lambda(\mathbf{z}) = \frac{NA}{\sigma^2} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z_i - \frac{1}{2} A \right)$$

判决表达式为:
$$\frac{NA}{\sigma^2} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i - \frac{1}{2} A \right) \stackrel{>}{<} ln \eta_0$$

令
$$\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z_i$$
,将上式整理后得: \bar{z} $\stackrel{H_1}{\stackrel{>}{\stackrel{}{\sim}}} \frac{\sigma^2}{NA} \ln \eta_0 + \frac{1}{2} A = \gamma$ H_0

检验统计量z为样本均值。为了确定判决的性能,首先需要确

定检验统计量的分布: 在 H_0 为真时, $\bar{z}|H_0 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N v_i$, 那么,

$$f_{\bar{z}}(\bar{z}|H_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2/N}} exp\left(-\frac{\bar{z}^2}{2\sigma^2/N}\right)$$

在 H_1 为真时, $\bar{z}|H_1 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(A+v_i) = A + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}v_i$,那么

$$f_{\bar{z}}(\bar{z}|H_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2/N}} exp\left(-\frac{(\bar{z}-A)^2}{2\sigma^2/N}\right)$$

这个等价要注意

检测概率 $P_D = P(\Lambda(\mathbf{z}) > \eta_0 | H_1) = P(\bar{z} > \gamma | H_1)$

$$= \int_{\gamma}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2/N}} exp\left(-\frac{(\bar{z}-A)^2}{2\sigma^2/N}\right) d\bar{z} = Q\left(\frac{\sqrt{N}(\gamma-A)}{\sigma}\right)$$

当采用最小错误概率准则且 $P(H_1)=P(H_0)$ 时, $\eta_0=1$,判决表达式为

$$\bar{z} \stackrel{H_1}{<} \frac{1}{2}A = \gamma$$

$$H_0$$

$$P_F = Q\left(\frac{\sqrt{N}A}{2\sigma}\right), \quad P_D = Q\left(-\frac{\sqrt{N}A}{2\sigma}\right) = 1 - Q\left(\frac{\sqrt{N}A}{2\sigma}\right)$$

总的错误概率为:
$$P_e = P(H_0)P_F + P(H_1)P_M = Q\left(\frac{\sqrt{N}A}{2\sigma}\right)$$

4、纽曼-皮尔逊准则(neyman-pearson)

在许多情况下,给出信号的先验概率或代价因子是困难的,如雷达系统。此时可采样*纽曼-皮尔逊准则*:指定一个虚警概率 α 的容许值,在约束 α 不变的条件下使检测概率 $\mathbf{P}_{\mathbf{D}}$ 达到最大。即:

利用拉格朗日乘子构造函数:

$$J = P_M + \lambda (P_F - \alpha)$$

划分判决域使】最小。

$$J = \int_{Z_0} f(z \mid H_1) dz + \lambda \left[\int_{Z_1} f(z \mid H_0) dz - \alpha \right]$$
$$= \lambda (1 - \alpha) + \int_{Z_0} \left[f(z \mid H_1) - \lambda f(z \mid H_0) \right] dz$$

划分的结果是使】最小的分界面满足:

$$H_{1}$$

$$\Lambda(\mathbf{z}) = \frac{f(\mathbf{z} | H_{1})}{f(\mathbf{z} | H_{0})} < \lambda$$

$$H_{0}$$

选取 λ 满足 α =常数的约束条件,即:

$$\alpha = \int_{Z_1} f(\mathbf{z} | H_0) d\mathbf{z} = \int_{\lambda}^{\infty} f[\Lambda(\mathbf{z}) | H_0] d\Lambda$$

假设检验问题转化似然比检验

例8.6:设有两种假设,

H₀: z=v

 H_1 : z=1+v

其中 $v\sim N(0,1)$,规定 $\alpha=0.1$,试根据一次观测数据z,

应用奈曼-皮尔逊准则给出最佳判决及相应检测概率。

【解】

解】
$$H_1$$
 由例8.1可知,似然比检验为: $\Lambda(z) = exp\left(z-\frac{1}{2}\right)$ $\begin{pmatrix} Z \\ Z \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} Z \\ Z \end{pmatrix}$

或者化简为:
$$Z$$
 $= \gamma$ H_1 Z $= \gamma$ H_0

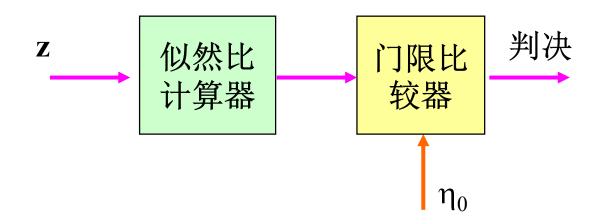
门限γ由给定的虚警概率确定,

$$\int_{\gamma}^{\infty} f(z|H_0) dz = \int_{\gamma}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = 0.1$$

由上式可解得门限γ=1.29,对应的检测概率为

$$P_D = \int_{\gamma}^{\infty} f(z|H_1)dz = \int_{\gamma}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-1)^2/2} dz = 0.389$$





最佳检测器结构

从以上介绍的几种判决准则的判决表达式可以看出, 无论采用什么准则,判决表达式最终都归结成似然比检验 的形式,可见似然比检验是最佳检验的基本形式。

中山大學 8.3 检测性能及其蒙特卡罗仿真

1、接收机工作特性

 $H_0: z_i = v_i$, i = 1, 2, ..., N

 $H_1: z_i = A + v_i$, i = 1, 2, ..., N

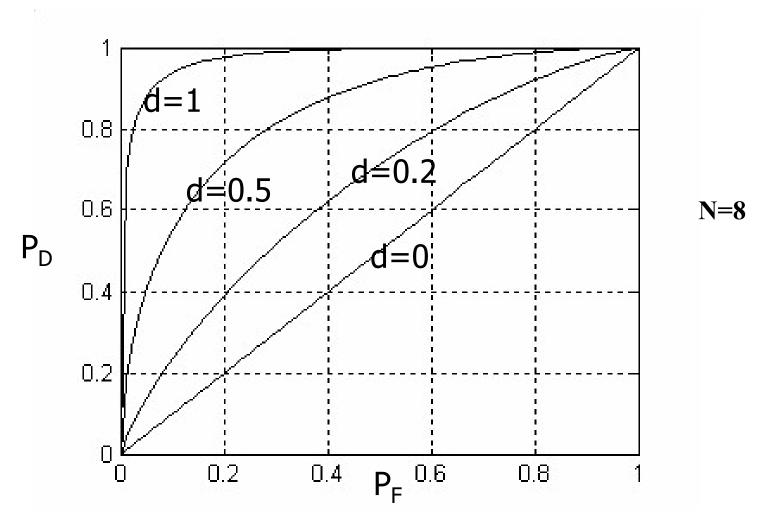
其中**v**是均值为零、方差为**1**的正态随机变量;代价函数及先验概率已知,作出贝叶斯准则的判决。

$$P_{F} = Q\left(\frac{\sqrt{N}\gamma}{\sigma}\right) \longrightarrow \gamma = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}Q^{-1}(P_{F}) \longrightarrow P_{D} = Q\left(\frac{\sqrt{N}(\gamma - A)}{\sigma}\right)$$

$$P_D = Q(Q^{-1}(P_F) - \sqrt{N}d) \qquad d = A/\sigma$$

给定一定的信噪比,画出 P_D - P_F 曲线称为接收机工作特性(ROC)





接收机ROC曲线

ROC曲线性质

- \diamondsuit 1、当 α =0,有 η_0 = ∞ , P_D =0;
- \diamond 2、当 α =1,有 η_0 = $-\infty$, P_D =1;
- ◆ 3、所有似然比检验的接收机工作特性均位于对角线之上;
- ◆ 4、所有似然比检验的接收机工作特性都是上凸的;
- ◇ 5、接收机工作特性在某点处斜率等于该点上PD和PF所要 求的检测门限值η;

【证明】

$$P_D = \int_{\eta}^{\infty} p(\Lambda(z) \mid H_1) d\Lambda(z) \stackrel{\Delta}{=} P_D(\eta), \quad P_F = \int_{\eta}^{\infty} p(\Lambda(z) \mid H_0) d\Lambda(z) \stackrel{\Delta}{=} P_F(\eta)$$



中山大學 8.3 检测性能及其蒙特卡罗仿真

微分得到:
$$\frac{dP_D(\eta)}{d\eta} = -p(\eta \mid H_1), \qquad \frac{dP_F(\eta)}{d\eta} = -p(\eta \mid H_0)$$

所以
$$\frac{dP_D(\eta)}{dP_F(\eta)} = \frac{-p(\eta \mid H_1)}{-p(\eta \mid H_0)} = \frac{p(\eta \mid H_1)}{p(\eta \mid H_0)}$$

又因为
$$P_D(\eta) = \int_{\eta}^{\infty} p(\Lambda(z)|H_1)d\Lambda(z) = \int_{Z_1} p(z|H_1)dz =$$

$$\int_{Z_1} \Lambda(z) p(z \mid H_0) dz = \int_{\eta}^{\infty} \Lambda(z) p(\Lambda(z) \mid H_0) d\Lambda(z)$$

再对上式微分:
$$\frac{dP_D(\eta)}{d\eta} = -\eta p(\eta \mid H_0)$$

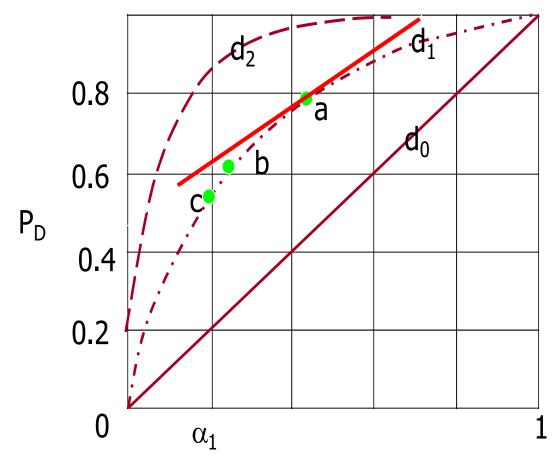
所以
$$\frac{dP_D(\eta)}{dP_F(\eta)} = \frac{-p(\eta \mid H_1)}{-p(\eta \mid H_0)} = \frac{-\eta p(\eta \mid H_0)}{-p(\eta \mid H_0)} = \eta$$

【证毕】



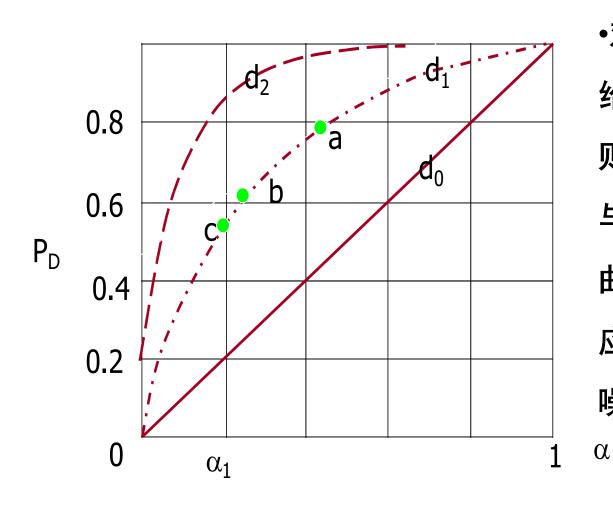
◇ 6、检测系统的接收机工作特性是似然比检验性能的完

整描述。



在贝叶斯准则、最小 平均错误概率准则下、先 根据先验知识求出似然比 检测门限n,以n为斜率的 直线与信噪比为d的曲线相 切,如图中a点,该切点所 对应的Pn和Pr就是该信噪 此下的两种判决概率。

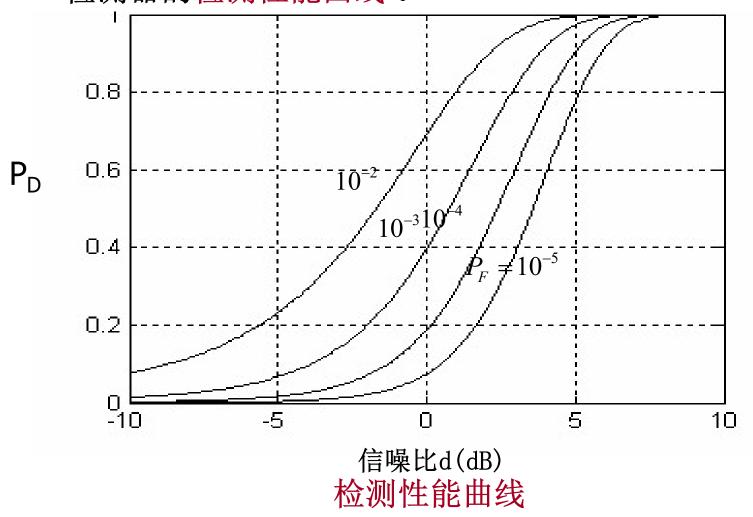




•对奈曼一皮尔逊准则, 给定约束条件 $P_F = \alpha$, 则其解为 $P_F = \alpha$ 的直线 与信噪比d的工作特性 曲线的交点c, 该点对 应的Pn就是该约束及信 噪比下的检测概率。



给定虚警概率,检测概率与信噪比之间的关系曲线称为检测器的检测性能曲线。



1 复合假设检验

- 在假设检验问题中,对于已知信号的假设称为简单假设;
- 对于含有未知参量信号的假设称为复合假设;
- 对于未知参量信号的检测是复合假设检验.

$$H_0: z_i = \theta_0 + v_i \quad i = 1, 2, ..., N$$

$$H_1: z_i = \theta_1 + v_i \quad i = 1, 2, ..., N$$

未知参量或随机变量

2 贝叶斯方法

假定已知 $f(\theta_0)$ 和 $f(\theta_1)$

$$f(\mathbf{z} | H_0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{z} | \theta_0, H_0) f(\theta_0) d\theta_0$$

$$f(\mathbf{z} | H_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{z} | \theta_1, H_1) f(\theta_1) d\theta_1$$

$$\frac{f(\mathbf{z} | H_1)}{f(\mathbf{z} | H_0)} \stackrel{H_1}{\underset{H_0}{\leq}} \eta_0$$

复合假设检验变换为简单的假设检验.



- 3 一致最大势检验(Uniformly Most Powerful test)
 - ◆当 θ_1 、 θ_2 为未知常数时,这时可采用纽曼—皮尔逊检验,即约束虚警概率为常数,使检测概率最大。
 - ◆如果最佳检测器的结构与未知参量 θ_1 、 θ_2 无关,称为一致最大势(UMP)检验。

3 广义似然比检验

对未知参数采用最大似然估计,并将此估计当作真值来进行似然比检验。

$$\Lambda(\mathbf{z}) = \frac{f(\mathbf{z} | \mathbf{H}_1, \hat{\boldsymbol{\theta}}_1)}{f(\mathbf{z} | \mathbf{H}_0, \hat{\boldsymbol{\theta}}_0)} \quad \begin{array}{c} \mathbf{H}_1 \\ > \\ \mathbf{H}_0 \end{array} \quad \boldsymbol{\eta}_0$$

例8.10: 设有两种假设

$$H_0: z_i=v_i$$
, $i=1,2,...,N$

$$H_1: z_i = A + v_i$$
, $i = 1,2,...,N$

其中 v_i 是服从均值为零、方差为 σ^2 的高斯白噪声序列,A未知,求广义似然比检验。

【解】 由于参数A未知,那么首先求H₁假设下参数A的最大似然估计,即根据最大似然方程,得:

$$\hat{A}_{ml} = \bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z_i$$



似然比为:
$$\Lambda(\mathbf{z}) = \frac{f(\mathbf{z}|H_1, \hat{A}_{ml})}{f(\mathbf{z}|H_0)} = \frac{(2\pi\sigma^2)^{-N/2} exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}(z_i - \bar{z})^2\right]}{(2\pi\sigma^2)^{-N/2} exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}z_i^2\right]}$$

对数似然比为:
$$\ln \Lambda(\mathbf{z}) = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{N} (z_i - \bar{z})^2 + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{N} z_i^2 = \frac{N\bar{z}^2}{2\sigma^2}$$

判决表达式为:
$$ar{z}^2$$
 $\begin{picture}(100,0) \put(0,0){\line(0,0){12}} \put(0,0){\$

门限γ由给定的虚警概率确定。

【结束】



例8.11: 设有两种假设

$$H_0: z_i=v_i$$
, $i=1,2,...,N$

$$H_1: z_i = A + v_i$$
, $i = 1, 2, ..., N$

其中 v_i 是服从均值为零、方差为 σ^2 的高斯白噪声序列假定 σ^2 及直流电平A均是未知的。

【解】 很显然这仍然是一个复合假设检验问题,需要采用广义 似然比检验,判决形式为

$$\frac{f(\mathbf{z}|H_{1},\hat{A}_{ml},\hat{\sigma}_{1ml}^{2})}{f(\mathbf{z}|H_{0},\hat{\sigma}_{0ml}^{2})} \stackrel{>}{<} \eta_{0} \tag{7}$$

其中 \hat{A}_{ml} 是在 H_1 条件下对未知电平A的最大似然估计。 $\hat{\sigma}_{1ml}^2$ 、 $\hat{\sigma}_{0ml}^2$ 是分别在 H_1 和 H_0 条件下对噪声方差的估计,这两个估计是不同的,由例7.5和例7.6可得,

$$\hat{A}_{ml} = \bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z_i$$
, $\hat{\sigma}_{1ml}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (z_i - \bar{z})^2$, $\hat{\sigma}_{0ml}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z_i^2$

代入(7)得:

$$\begin{pmatrix} \frac{\widehat{\sigma}_{0ml}^2}{\widehat{\sigma}_{1ml}^2} \end{pmatrix}^{N/2} > \eta_0 \qquad 或者: \ln \left(\frac{\widehat{\sigma}_{0ml}^2}{\widehat{\sigma}_{1ml}^2} \right) > \frac{2\ln \eta_0}{N} \qquad (8)$$

中山大學 8.4 复合假设检验

$$\Sigma: \quad \hat{\sigma}_{1ml}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (z_i - \bar{z})^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (z_i^2 - 2z_i \bar{z} + \bar{z}^2) =$$

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z_i^2 - \bar{z}^2 = \hat{\sigma}_{0ml}^2 - \bar{z}^2$$

那么,:
$$ln\left(\frac{\widehat{\sigma}_{0ml}^2}{\widehat{\sigma}_{1ml}^2}\right) = ln\left(\frac{\widehat{\sigma}_{1ml}^2 + \bar{z}^2}{\widehat{\sigma}_{1ml}^2}\right) = ln\left(1 + \frac{\bar{z}^2}{\widehat{\sigma}_{1ml}^2}\right)$$

由于In(1+x)是x的单调上升函数,(8)式与下面的判决表达式等效:

$$T(\mathbf{z}) = \frac{\bar{z}^2}{\widehat{\sigma}_{1ml}^2} > \qquad (9)$$

$$H_1$$

门限 γ 由给定的虚警概率确定,与例8.10比较可以看出,在噪声方差未知的情况下,用噪声方差的估计去归一化检验统计量。下面证明,在 H_0 情况下,检验统计量 $T(\mathbf{z})$ 与噪声方差无关。令 V_i = σu_i ,其中u(i)是零均值单位方差的高斯白噪声,则

$$T(\mathbf{z})|H_0 = \frac{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N v_i\right)^2}{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N (v_i - \bar{v})^2} , \quad \sharp \, \dot{\mathbf{p}} \, \bar{\mathbf{v}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N v_i = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \sigma u_i = \sigma \bar{u} ,$$

代入上式得

$$T(\mathbf{z})|H_0 = \frac{(\sigma \bar{u})^2}{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\sigma u_i - \sigma \bar{u})^2} = \frac{(\bar{u})^2}{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(u_i - \bar{u})^2}$$
(10)



可此可见,在H₀情况下,检验统计量与噪声方差无关,它的概率密度也与噪声方差无关,

因此,虚警概率为:
$$P_F = \int_{\gamma}^{\infty} f_{T|H_0}(t)dt \tag{11}$$

根据纽曼-皮尔逊准则, 判决门限γ由给定的虚警概率P_F确定。 噪声的方差反映了噪声的强度, 由(10)和(11)式可以看出, 检测器的虚警概率与噪声强度无关, 这种噪声强度变化时, 虚警概率保持恒定的特性称为恒虚警率(CFAR)特性, CFAR特性对许多应用来说都是必须的, 如雷达信号的检测等。

【完毕】